



(1 / 6)

20210427 評基認第 006 号
2021 年 4 月 28 日

認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を ASNITE 認定プログラムの試験事業者として認定する。

認 定 識 別: ASNITE 0003 Testing

適合性評価機関の名称: 株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター

法人の名称: 株式会社 ECSEC Laboratory

適合性評価機関の所在地: 東京都千代田区神田錦町三丁目 21 番
ちよだプラットフォームスクウェア

認 定 範 囲: 2 ページ目以降のとおり

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書 (ASNITE 試験事業者 IT 認定プログラム) に記載した認定要求事項

認定発効日: 2021 年 4 月 28 日

認定の有効期限: 2025 年 4 月 27 日

初回認定発効日: 2002 年 12 月 19 日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長

- ・ IAJapan (独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋認定協力機構) の MRA (相互承認取決め) に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・ この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・ IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

事業所名 : 株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター
 事業所所在地 : 東京都千代田区神田錦町三丁目 21 番
 ちよだプラットフォームスクウェア
 実施する業務 : 評価センターの認定範囲の業務

<評価センターの認定範囲>

認定区分	情報技術—コモンクライテリア評価—ソフトウェア	
試験対象製品	情報技術(IT)製品	
試験する成分、パラメータ又は特性	Common Criteria for Information Technology Security Evaluation - part2: Security Functional Components に規定するセキュリティ機能要件	
試験実施場所	ラボラトリの恒久的施設、顧客の施設	
試験方法	(ITセキュリティ評価基準) ・ Common Criteria for Information Technology Security Evaluation ・ Common Criteria for Information Technology Security Evaluation に係る独立行政法人情報処理推進機構 翻訳文書 ・ ISO/IEC 15408 Information Technology - Security Techniques - Evaluation Criteria for Information Technology Security (ITセキュリティ評価基準補足文書) ・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する評価基準補足文書	
	(ITセキュリティ評価方法) ・ Common Methodology for Information Technology Security Evaluation ・ Common Methodology for Information Technology Security Evaluation に係る独立行政法人情報処理推進機構 翻訳文書 ・ ISO/IEC 18045 Information Technology - Security Techniques - Methodology for Information Technology Security Evaluation (ITセキュリティ評価方法補足文書) ・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する評価方法補足文書	
セキュリティ保証コンポーネント	初回認定発効日 : 2002年12月19日 認定発効日 : 2021年4月28日	セキュリティターゲットの評価 (クラス ASE) プロテクションプロファイルの評価 (クラス APE) 評価保証レベル 1 (EAL 1) 評価保証レベル 2 (EAL 2) 評価保証レベル 3 (EAL 3)
	初回認定発効日 : 2004年6月4日 認定発効日 : 2021年4月28日	評価保証レベル 4 (EAL 4)
	初回認定発効日 : 2014年7月16日 認定発効日 : 2021年4月28日	ALC_FLR.2

事業所名 : 株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター
 事業所所在地 : 東京都千代田区神田錦町三丁目 21 番
 ちよだプラットフォームスクウェア
 実施する業務 : 評価センターの認定範囲の業務

<評価センターの認定範囲>

認定区分	情報技術—コモンクライテリア評価—ハードウェア (スマートカード等)	
試験対象製品	情報技術(IT)製品	
試験する成分、パラメータ又は特性	Common Criteria for Information Technology Security Evaluation - part2: Security Functional Components に規定するセキュリティ機能要件	
試験実施場所	ラボラトリの恒久的施設、顧客の施設	
試験方法	(IT セキュリティ評価基準) ・ Common Criteria for Information Technology Security Evaluation ・ Common Criteria for Information Technology Security Evaluation に係る 独立行政法人情報処理推進機構 翻訳文書 ・ ISO/IEC 15408 Information Technology - Security Techniques - Evaluation Criteria for Information Technology Security (IT セキュリティ評価基準補足文書) ・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する評価基準補足文書	
	(IT セキュリティ評価方法) ・ Common Methodology for Information Technology Security Evaluation ・ Common Methodology for Information Technology Security Evaluation に係る独立行政法人情報処理推進機構 翻訳文書 ・ ISO/IEC 18045 Information Technology - Security Techniques - Methodology for Information Technology Security Evaluation (IT セキュリティ評価方法補足文書) ・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する評価方法補足文書 ・ CCRA が公開するスマートカードに関する CC サポート文書 ・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する CC サポート文書と同等の文書	
セキュリティ保証 コンポーネント	初回認定発効日: 2012年8月23日 認定発効日 2021年4月28日	プロテクションプロファイルの評価 (クラス APE) 評価保証レベル 1 (EAL 1) 評価保証レベル 2 (EAL 2) 評価保証レベル 3 (EAL 3) 評価保証レベル 4 (EAL 4) 評価保証レベル 5 (EAL 5) ALC_DVS.2 AVA_VAN.5

事業所名 : 株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター
 事業所所在地 : 東京都千代田区神田錦町三丁目 21 番
 ちよだプラットフォームスクウェア
 実施する業務 : 評価センターの認定範囲の業務

<評価センターの認定範囲>

認定区分	情報技術-暗号モジュール試験-暗号ソフトウェアモジュール	
試験対象製品	情報技術(IT)製品	
試験する成分、パラメータ又は特性	ISO/IEC 19790 が規定するセキュリティ要件	
試験実施場所	ラボラトリの恒久的施設、顧客の施設	
試験方法	(暗号モジュールセキュリティ要件) ・ ISO/IEC 19790:2006 with ISO/IEC 19790:2006/Cor.1:2008 Information Technology - Security Techniques - Security Requirements for Cryptographic Modules ・ JIS X 19790:2009 セキュリティ技術-暗号モジュールのセキュリティ要求事項	
	(暗号モジュール試験要件) ・ ISO/IEC 24759:2008 Information Technology - Security Techniques - Test Requirements for Cryptographic Modules ・ JIS X 24759:2009 セキュリティ技術-暗号モジュールのセキュリティ試験要件	
セキュリティレベル	初回認定発効日： 2007年11月29日	基本暗号セキュリティ 暗号アルゴリズム実装試験
	認定発効日： 2021年4月28日	暗号ソフトウェアモジュール試験1(セキュリティレベル1~3)
試験方法	(暗号モジュールセキュリティ要件) ・ ISO/IEC 19790:2012(Corrected version 2015-12-15) Information Technology - Security Techniques - Security Requirements for Cryptographic Modules ・ JIS X 19790:2015 セキュリティ技術-暗号モジュールのセキュリティ要求事項	
	(暗号モジュール試験要件) ・ ISO/IEC 24759:2017 Information Technology - Security Techniques - Test Requirements for Cryptographic Modules ・ JIS X 24759:2017 セキュリティ技術-暗号モジュールのセキュリティ試験要件	
セキュリティレベル	初回認定発効日： 2021年4月28日	基本暗号セキュリティ 暗号アルゴリズム実装試験 暗号ソフトウェアモジュール試験3(セキュリティレベル1)
		暗号ソフトウェアモジュール試験4(セキュリティレベル2)

事業所名 : 株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター
 事業所所在地 : 東京都千代田区神田錦町三丁目 21 番
 ちよだプラットフォームスクウェア
 実施する業務 : 評価センターの認定範囲の業務

<評価センターの認定範囲>

認定区分	情報技術-暗号モジュール試験-暗号ハードウェアモジュール	
試験対象製品	情報技術(IT)製品	
試験する成分、パラメータ又は特性	ISO/IEC 19790 が規定するセキュリティ要件	
試験実施場所	ラボラトリの恒久的施設、顧客の施設	
試験方法	(暗号モジュールセキュリティ要件) ・ ISO/IEC 19790:2006 with ISO/IEC 19790:2006/Cor.1:2008 Information Technology - Security Techniques - Security Requirements for Cryptographic Modules ・ JIS X 19790:2009 セキュリティ技術-暗号モジュールのセキュリティ要求事項	
	(暗号モジュール試験要件) ・ ISO/IEC 24759:2008 Information Technology - Security Techniques - Test Requirements for Cryptographic Modules ・ JIS X 24759:2009 セキュリティ技術-暗号モジュールのセキュリティ試験要件	
セキュリティレベル	初回認定発効日： 2007 年 11 月 29 日 認定発効日： 2021 年 4 月 28 日	基本暗号セキュリティ 暗号アルゴリズム実装試験 暗号ハードウェアモジュール試験 1 (セキュリティレベル 1~3)
試験方法	(暗号モジュールセキュリティ要件) ・ ISO/IEC 19790:2012 (Corrected version 2015-12-15) Information Technology - Security Techniques - Security Requirements for Cryptographic Modules ・ JIS X 19790:2015 セキュリティ技術-暗号モジュールのセキュリティ要求事項	
	(暗号モジュール試験要件) ・ ISO/IEC 24759:2017 Information Technology - Security Techniques - Test Requirements for Cryptographic Modules ・ JIS X 24759:2017 セキュリティ技術-暗号モジュールのセキュリティ試験要件	
セキュリティレベル	初回認定発効日： 2021 年 4 月 28 日	基本暗号セキュリティ 暗号アルゴリズム実装試験 暗号ハードウェアモジュール試験 3 (セキュリティレベル 1) 暗号ハードウェアモジュール試験 4 (セキュリティレベル 2) 暗号ハードウェアモジュール試験 5 (セキュリティレベル 3)

事業所名 : 株式会社 ECSEC Laboratory 評価センター
 事業所所在地 : 東京都千代田区神田錦町三丁目 21 番
 ちよだプラットフォームスクウェア
 実施する業務 : 評価センターの認定範囲の業務

<評価センターの認定範囲>

認定区分	情報技術—システム LSI 侵入テスト	
試験対象製品	スマートカード及びそれに関連する IC 及び端末等	
試験する成分、パラメータ又は特性	スマートカードに関する CC サポート文書等に基づいて試験される、耐タンパー性	
試験実施場所	ラボラトリの恒久的施設、顧客の施設	
試験方法	(システム LSI 侵入テスト評価方法) <ul style="list-style-type: none"> ・ CCRA が公開するスマートカードに関する CC サポート文書 ・ 独立行政法人情報処理推進機構が公開する CC サポート文書と同等の文書 	
侵入テスト分類	初回認定発効日： 2012年8月23日 認定発効日 2021年4月28日	スマートカードに関する CC サポート文書に基づく AVA_VAN に係るシステム LSI への侵入テスト

(以上)